

NTS5700 MRAM対応メモリサイクリングテスター販売開始

株式会社ウェルは、次世代不揮発性メモリのMRAMに対応した高速メモリサイクリングテスターの販売を10月1日より開始いたしました。



概略

次世代不揮発性メモリのひとつであるMRAMに対応し独自設計のハードウェア・パターンジェネレーターを搭載し従来比2倍以上(NTS4700テスター)の高速サイクリングテストを実現。

特長

- デバイス同時測定数：最大768個(16ビット品、NORフラッシュの場合)
- DUT供給電源：4電源(追加4電源まで増設可能)
- ファイルビットカウンター：4GB
- エラーキャプチャーRAM：Max.4K
- アドレスチャンネル：64
- CEマスク機能：72チャンネル(完全個別制御可能)
- コントロールライン：16ライン(双方向)+32ライン(Drive Only)
- 長期信頼性試験対応：すべての接続チャンネルのオープン・ショート試験可能
- システムキャリブレーション機能：キャリブレーションボードによる全ての電源校正可能

用途

- NOR型フラッシュ、シリアルNAND、FRAM、MRAM等の不揮発性メモリ書換え耐久性試験
- Vth特性評価
- 高速データ書き込み・ファンクションテスター

システム構成

- 本体：3チャンバー恒温槽(1チャンバー：-55℃～+150℃、2チャンバー：常温～+150℃)
- ドライバーモジュール：12sets
- ホストPC：1set